

様々な偏光状態のX線による極限環境下での分光、ナノビーム分光を特徴とする

ビームラインの特徴

BL39XUでは、様々な偏光状態のX線による分光測定が行えます。直線アンジュレータ光源から得られる水平偏光に加え、透過型X線移相子で生成した左右の円偏光や垂直偏光が利用できます。また、円偏光変調法による高精度なXMCD測定が行えます。実験ハッチは2つあり、実験ハッチ1では強磁場・高圧・極低温という極限環境下でのX線分光測定、実験ハッチ2ではミラーによって100 nmに集光されたX線ビームを使った顕微分光測定が行えます。

主要実験技術

1. X線磁気円二色性 (XMCD)
2. X線吸収 (XAS)・発光分光
3. X線磁気散乱
4. ナノビームX線分光
5. 走査型XMCD顕微鏡

